## No, IS-9850A 来歷/REV. 製 仕 書 品 様 頁 1/4PRODUCT SPECIFICATION 制定年月日 5-19-'99 : 9850 B/S シリーズ 1.0 mmピッチ ボード トゥ ボード コネクタ ISSUE DATE SUBJECT: SERIES 9850 B/S 1.0 mm pitch board to board connector 改訂年月日 1-9-08 REVISED DATA

1.Scope

3.Rating

1. 適用範囲

本仕様書は,イリソ電子工業株式会社製 9850B/S シリーズ 1.0 mmピッチボード トゥ ボード コネクタに関する仕様及び性能上の 必要事項について規定する。

形状、寸法及び材質

構造、寸法、主要部品の材質、表面処理等は添付図面による。 嵌合ソケット:9850S、9852S、9854S、9856S

3. 定格

(1)最大定格電圧 : 125V(AC,DC)

(2)最大定格電流 : 1A

(3)使用温度範囲 -40~+105℃

4. 性能

特に規定のある場合を除き性能試験は下記の環境条件にて行う。

常温 : 15~35℃

: 25~85%RH(相対湿度)

常湿

5.Performance

4. Performance

All performance test, unless otherwise specified, is taken

This product specification is applied for IRISO ELECTRONICS

: -40~+105°C

CO., LTD. series 9850B/S 1.0 mm pitch board to board connector.

as per following environmental condition.

2. Configurations dimensions and materials

See the product drawing attached.

(2)Maximum rating current: 1A

(3)Temperature range

Mating socket, :9850S,9852S, 9854S, 9856S

(1)Maximum rating voltage: 125 V (AC,DC)

Ambient temperature : 15~35℃ Ambient humidity

: 25~85%RH (relative humidity)

5. 特性

5-1.電気的特性 5-1. Electrical performances

No. 項目/Items 条件/Test conditions 規格/specifications  1 接触抵抗 Contact resistance 抵抗計にて測定する。 It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.  2 耐電圧 隣接する極間に AC250Vを1分間印加する。 Dielectric withstanding voltage  3 絶縁抵抗 所接する極間に DC250Vを印加し、測定する。 Insulation resistance 関接する極間に DC250V を印加し、測定する。 Insulation resistance は terminals.  ※件/Test conditions 規格/specifications 初期値: 40mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 各試験後:60mΩ以下 After each test: 60mΩ or below が開始に対象を表現されます。 初期値:500MΩ以上 Initial:500MΩ以上 Initial:500MΩ以上 Miatial:500MΩ以上	
Example of the first stance   Limit of the first stan	
It shall be measured by the dry electric circuit specified as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.  After each test: 60mΩ or below After each test: 60mΩ	
as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.  After each test: 60mΩ or below    After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ	
as follows; 1mA, 20mV, 1kHz frequency.  After each test: 60mΩ or below    After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ or below   After each test: 60mΩ	
Dielectric withstanding voltage  3 絶縁抵抗 隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 初期値: 500MΩ以上 It shall be measured when DC 250V is applied to between next Initial: 500MΩ or more 🖍	
withstanding voltage  3 絶縁抵抗 隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 初期値:500MΩ以上 Insulation It shall be measured when DC 250V is applied to between next Initial:500MΩ or more 🔨	
voltage 3 絶縁抵抗 隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 初期値:500M Ω以上 Insulation It shall be measured when DC 250V is applied to between next Initial:500M Ω or more 🖍	
3 絶縁抵抗 隣接する極間に DC250V を印加し、測定する。 初期値:500M Ω以上 Insulation It shall be measured when DC 250V is applied to between next Initial:500M Ω or more 🖍	
Insulation It shall be measured when DC 250V is applied to between next Initial: 500MΩ or more Δ	
resistance terminals 面視試驗後·500MOULE	
[10]10世代教授 · 5001/11/22/人工	
After humidity test: $500 \mathrm{M}\Omega$ or r	ore 🖄
4     外観     目視     有害となる割れ、剥がれ、ガタ	
変形、変色等のない事。	
Appearance Visual Should not have any flaw, scratch,	
discoloration and crushed .	

5-2 機械的特性 5-9 Functional performance

5-2.1发 (		<u>5-2.Functional performance</u>	<u>nce</u>
No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
1	コンタクトの保持力	コンタクトに25mm/分の速度で荷重を加え、コンタクトが	4.9N 以上
		ハウジングより抜け始めるまでの荷重を測定する。	
	Pin retention force	It shall be pulled to the contact at the speed of 25mm	4.9N or more.
		per minute, and measured the force when the contact	
		begins to remove from the base.	
2	ピンの保持力	ピンに 25mm/分の速度で荷重を加え、ピンがベースより抜け	4.9N以上
		始めるまでの荷重を測定する。	·
	Pin retention force	It shall be pushed to the pin at the speed of 25mm per	4.9N or more.
		minute, and measured the force when the pin begins to	
		remove from the base.	
3	挿抜力	ソケットとピンヘッダーを25mm/分の速度で挿抜を行ない、	初期値にて/Initial(単極にて)
		この時の荷重を測定する。	挿入力: 2.45N以下/極
	Insertion/extraction	The socket and pin header shall be mated and unmated	抜去力: 0.49N以上/極
	force	at the speed of 25mm per minute and measured the	Insertion force: 2.45N or
	•	force of insertion and extraction.	below / terminal
			Extraction force: 0.49N or
			more / terminal
4	挿抜耐久性	ソケットとピンヘッダーを 25mm/分の速度で 30 回繰り返し	60mΩ以下
		挿抜を行ない、試験後の接触抵抗を測定する。	
	Insertion/extraction	The socket and pin header shall be mated and unmated	$60 \text{m}\Omega$ or below
	endurance	30 times at the speed of 25mm per minute and measured	
		the contact resistance after the test.	

	No.	IS-9850A	来歷/REV.	9	頁/Page	2/4
--	-----	----------	---------	---	--------	-----

No.	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
5	振動試験	コネクタを嵌合した状態にて、振幅 1.5 ㎜ 振動周波数	試験中: 1 μs 以上の瞬断のない事。
		10~55~10Hz 毎分の条件で嵌合軸を含むお互いに直角な	試験後:60mΩ以下
	Vibration test	3方向に各々 2時間 計6時間 の振動を加える。試験中瞬断の	
		有無を確認する。試験後接触抵抗を測定する。	
		The connector mated is vibrated in the frequency range of	Discontinuity : $1 \mu s$ or less.
		10∼55∼10Hz per minute and in the constant vibration	After the test : $60 \text{m}\Omega$ or below
		amplitude 1.5 mm. This motion is applied for period of	
		6 hours in one of 3 multilateral perpendicular directions	
		(X,Y,Z-axis) included mating axis. It shall be tested	
		the discontinuity of the contact current during the test and	
6	衝撃試験	measured the contact resistance after the test.  コネクタを嵌合した状態にて、治具に取付け、加速度 490m/s <sup>2</sup> 、	試験中1μs 以上の瞬断の無いこと
U	判事政歌	衝撃作用時間 11ms を X,Y,Z 方向の 6 面に各 3 回加え、試験後接触	
	Shock test	抵抗を測定する。	即級人及 · 0011182 以 [·
	SHOOM COST	The connector mated are installed in the machine. They	
		are applied pulses 3 times to each 6 faces of 3 multilateral	Discontinuity : $1 \mu s$ or less.
		perpendicular directions(X,Y,Z); in conditions as specified;	After the test : $60 \text{m}\Omega$ or below
		acceleration of 490m/s <sup>2</sup> and shock pulses for a duration of	
		11ms. It shall be measured the contact resistance	
		after the test.	

5-3. Bryironmental performance

No. 項目 / Items 条件 / Test conditions	or below or below
横置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  2 耐湿性 コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RH の雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 Humidity The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	or below Or below
Heat resistance The connector mated is exposed in the heat chamber 105±2℃ for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  2 耐湿性 コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RHの雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 Humidity The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	or below
96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  2 耐湿性 コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RHの雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 Humidity The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	or below
2 耐湿性 コネクタを嵌合した状態にて、温度 60±2℃、相対湿度 90~95%RHの 雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 Humidity The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	or below
雰囲気中に 96 時間放置し 放置後接触抵抗を測定する。 The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	or below
Humidity The connector mated is exposed in the humidity chamber 60±2℃, 90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	
90~95%RH for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.  3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	
resistance after the test. 3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	ı K
3 塩水噴霧試験 コネクタを嵌合した状態にて、槽内温度 35±2℃、濃度 5±1%の塩水 60mΩ以	J.T.
	V L
Salt spray test The connector mated is exposed in the salt spray chamber 60mΩ o	or helow
$35\pm2^{\circ}$ C, $5\pm1^{\circ}$ S salt density for 48 hours. It shall be measured	JI DCIOW
the contact resistance after the test.	
4 S O <sub>2</sub> ガス試験 コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃、相対湿度 75%、濃度 60mΩ以	下
10±3ppm.の雰囲気中に 96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	
S $O_2$ gas test The connector mated is exposed in the SO <sub>2</sub> gas chamber $40\pm2$ °C, $60$ m $\Omega$ o	or below
75%RH 10±3ppm for 96 hours. It shall be measured the contact	
resistance after the test.	
5 H <sub>2</sub> Sガス試験 コネクタを嵌合した状態にて、温度 40±2℃, 相対温度 75%、濃度 60mΩ以	下
3±1ppm の雰囲気中に96 時間放置し、放置後接触抵抗を測定する。	1 1
H <sub>2</sub> S gas test The connector mated is exposed in the H <sub>2</sub> S gas chamber $40\pm2^{\circ}$ C, $60\text{m}\Omega$ of	or below
75%RH 3±1ppm for 96 hours. It shall be measured the contact resistance after the test.	
	ı K
し、試験後接触抵抗を測定する。	.
Thermal The connector mated is exposed 10 cycles in the following $60 \text{m}\Omega$ or	or below
shock test temperature. It shall be measured the contact resistance after	
the test.	
+85± 2°C	
Ambient 30min	
常温 temperature	
30min	
Johnni John Harris and Market	
-55±3℃	

No. IS-9850A 来歷/REV. 9	頁/Page 3/4
------------------------	------------

規格/specifications

	項目/Items	条件/Test conditions	規格/specifications
7	温湿度サイクル試験	コネクタを嵌合した状態で下図の温湿度条件を1サイクルとして	60mΩ以下
		10 サイクル実施し、試験後接触抵抗を測定する。	
	Humidity	The connector mated is exposed 10 cycles in the following	$60 \mathrm{m}\Omega$ or below
	Resistance (cycling)	conditions. It shall be measured the contact resistance after the test.	
	(cycling)	the test.	
		+80±2°C	
		90~95%RH	
		-20±3℃	
		20130	
		$\Leftrightarrow$ 2h $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ 2h $\Rightarrow$ $\Leftrightarrow$ 2h $\Rightarrow$	
		← 1 cycle →	

5-4.Other performance

5-4.その他の特性

項目/Items

No.

1 半田付け性 コネクタの半田付け部を230±5℃の半田槽に3±0.5秒浸す。 浸した面積の95%以上に半田が Solderability The terminal of connector shall be put into the solder bath むらなく付着すること。 230±5℃、3±0.5s. Solder shall be covered 95% or more of the area that is dipped into the solder bath. 半田耐熱性 下記条件にて、半田耐熱試験を行う。 2 端子のガタ、割れ等異常のない事。 Resistance to The connector shall be tested resistance to soldering heat in Should not have any flaw, scratch and soldering heat the following conditions. crack. (1)リフローの場合/In case of reflow 240°CMAX(ピ-ク温度) (Peak temperature) (30s)200°CMIN. (90s) (予熱 150~180℃) (pre-heat: from 150 to  $180^{\circ}$ C) 温度は、コネクタ上面の温度とする。

The temperature shall be measured on the surface of the

:  $5\pm0.5s$ 

:  $3\pm0.5s$ 

半田槽温度 / temperature : 260±5℃

半田鏝温度 / temperature : 350±5℃

connector.

(2)ディップの場合 / In case of dip.

浸漬時間 / time

間 / time

(3)手半田 の場合/ In case of manual soldering.

条件/Test conditions

No. IS-9850A 来歷/REV. 9 頁/Page 4/4

## 6.使用上の注意

嵌合について

挿入の際、こじる事の無い様にゆっくりと嵌合してください。

・接続方法について

コネクタのみで基板の固定は行なわないで下さい。

使用の際、コネクタの実装位置に近い位置で、必ず基板をビス にて確実に固定して下さい。

コネクタに掛かる加速度は、セット組立品に於いても 43.12m/s² 以下とする事。

(共振振動が加わらない事。)

## 6.Attention of using 9850S/B connector

· Mating of 9850S/B connector

When the connector is mating, connector shall not be twisted, and then mated it slowly.

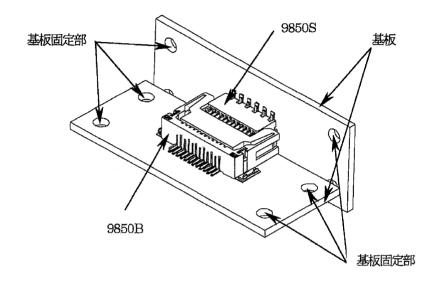
· Connect of 9850S/B connector

It shall not be held the connector only, when you are assembled for the connector and P.C.B.

When it shall be used the connector, the P.C.B. are held by the rivet certainty near mounting of the connector.

Acceleration of connector: 43.12m/s<sup>2</sup> or less.

(The connector shall not be added to resonance acceleration.)



10   15   15   15   15   15   15   15			制定 - 改訂言己金录	No IS	— 085 <i>0</i>	A 頁	0/5
0   49/5/21   新規   3127   河南   銀2   11   11   12   12   12   13   14   14   14   14   14   14   14	記号	年月日	記 事	1			
1 (10/3/2   使用:)   使用:   10   10   10   10   10   10   10   1	0	99/5/21	新 規	+	-		<del></del>
而了類性言、験、"85°C"→"105°C" 変更  S T, 单位系 (-統一  4-4.   "フラックス   一浸清   下後""95%以上   で更   F142  2 10/9/29 412 耐養   /2 5 V → 25 OV   4-1.3 乾 核 散 前 1/24 → 25 OV   5 夏更   万本   奈良 高山  5-2.6 落下衛 琴試験   武験中   人 5 I 以上。瞬龄。后生事。		00/3/2	使用温度鄞州"40~+86%"→"40~/08%"意象		<del></del>		
S T. 单位系 (~ 統一 4-4.   "フラックストラ浸清した後""95%以上人"変更 F142 2 10/9/29 4+12 耐電圧 /25V →250V, 4+1.3 競談 転前 /2V→250V ド 変更   河東 奈良 高山 5-2.6 第下衝撃試験 試験ド   人3 1以上。瞬瞬。原注事。 6 23.30 河中 全計 浦 101. 1. 18 4-2-4 郵販耐欠性: 万重→ 張陬抵抗穴変更 G330 河中 全計 浦 101. 4. 11 5. 使用上の注意。 103. 11. 11 5. 使用上の注意。 103. 11. 11 S1単位の統一。 103. 11. 11 S1単位の統一。 107. 1. 9 載金ソケット:98505. 98525. 98545. 98565. 並記 H729 放下 浦 107. 1. 9 載金ソケット:98535. 26 言己 「ア つフ. 1. 9 載金ソケット:98535. 26 言己 「標題、1. 適用範囲 コネクタ2 "9850 B/S" 107. 10. 9 ち-4、No. 2 半日耐転性 基板いの一面→コネクタ上面 ひの夕のか (元々末 高木 安井)			而熟性試験"85°″→"/nt°n" 蓝更	-	1.0.11.4	171/6	[0]
A-4.  "フラックストラ浸清」下後""95%以上に"変更 F142     2 10/9/29 41.2 前妻 F25V → 250V, 4-1.3 乾 該 前 125V→ 250V に 変更   万中 奈良 高山 1-2.6				-	-	}	
2 00/9/29 4-1.2 耐養圧/25V→25QV,4-1.3 絶核抵抗/25V→25QV 下変更   万申 奈良 高山			4-4.1 "フラックスに浸清1た格""9よ%以上に"哲里	L142	-		
1-2.6	2	80/9/z9	4-1.2 耐電圧/25V→25QV 4-1.3 親級抵抗/25V→25QV 15 万里	2	一百曲	<b>太</b> è	À.I
3 101.1.18 4-2-4 抑取耐久性: 万重→ 強配的. 「変更			1-2.6 装下值 翠試縣 就 験中 Las ly Las 解版 a 唇 未 事			:3/.[c	12111
3 01.1.18 4-2-4 郵政耐久性: 万重→議師抵抗に変更				1	-		
4. 107.4.11 5. 使用上の注意。 5. 62.7.15 嵌点ソフェト: 9850.S. 9852.S. 9854.S. 9856.S. 虚記: H729 献す 浦 6 103.11.11 S1単位の統一、	3	01. 1. 18	4-2-4 弹扳耐久性:汽车 -> 接触抵抗压劳更		沥井	献	- a`
5 62.7.15 載をソフィト: 9850 S. 9852 S. 9854 S. 9856 S. 遠記. H729 承子 浦 6 '03.11.11 S1単位の統一、	4.				and the same of the same of the same of	J <u>4</u> 2-1	
6 03.11.11 S1単位の統一、 4-3-2 耐湿性 40±2°C→60±2°C A0123	5				+ <u> </u>		-
4-3-2 耐湿性 40±2°C → 60±2°C A0123  7 07.1.9 嵌合ソケット: 98535 注意乙 標題、1 逝用範囲 コネクタ名"9850B/S" → "9850B/985*S"変更  体裁 を現行のものに変更 27923 衣全 あす 小秋田 307.10.9 5-4. No.2 半田耐熱性 基板100円->面→コネクタ上面 3040分 佐々木 高木 空井	6	03.11.11	S1単位の統一、	ananinaandaa	- Commence	水周	
7 07.1.9 嵌合:15-11: 98535 注言			4-3-2 耐湿性 40±2°C → 60±2°C	A0123	7.93.0	//).	(/2-)
標題、1 通用範囲 コネクタ名"9850 B/S" → "9850 B/985* S"変更 体裁を現行のものに変更 27923 大全 ある 小秋© 8 107·10.9 5-4. No.2 半田耐熱性 基板パターン面→コネクタ上面 ショケタタチ 佐々木 高木 空井	7	07.1.9	<b>数合ソケット:98535 追言</b> る	*************			
体裁を現行のものに変更 27923 大全 高す 1株成 8 107·10.9 5-4. No.2 半田耐熱性 基板パターン面→コネクタ上面 マタタのみ 佐々木 高木 空井			標題、1. 通用範囲 コネクタ2 "9850 B/S"				
8 107·10.9 5-4. No.2 半田耐熱性 基板109->面→コネクタ上面 3040A 佐々木 高木 空井			→"9850B/985*S" 変更				
8 07·10.9 5-4. No.2 半田耐熱性 基板10A->面→コネクタ上面 3040A 16.7末 高木 空井			体裁 を現行 のものに変更	27923	大全	恵す	一村会
U 107 10 et t 1 0 T at 1 at	8	07.10.9	5-4. No.2 半田耐熱性 基板1,0g~面→コネクタ上面	30408	佐な木	高木	
	9	67-12-25	5-1-3 Initial: 100→500MΩ, After humidity test: 100→500MQ 室更			****	*********
						***************************************	
					•••••		
	+						